

Formation Analyse des systèmes de mesure (MSA)

Objectifs : Connaître toutes les méthodes statistiques pour analyser un système de mesure

Compétences visées : - Appréhender la maîtrise des systèmes de mesure et son intégration dans la maîtrise statistique des processus

- Connaître le vocabulaire de la métrologie
- Avoir une introduction à un logiciel de statistique, par défaut le logiciel R
- Connaître les principes et techniques de l'inférence statistique et des systèmes de mesure, en calculant des intervalles de confiance et en menant des tests de comparaison et appariés
- Apprivoiser les différentes techniques de l'analyse des systèmes de mesure parmi l'échantillonnage et l'étalonnage
- Savoir mener l'étude d'incertitude par le calcul de plusieurs paramètres et indicateurs tels les variances et écart types, les indices R&R, Cpm et P/T
- Approfondir l'étude d'incertitude
- Examiner le cas de mesures nominales avec les indices Kappa et voir leur mise en œuvre

Durée : 2 jour(s) (14 heures)

Public : Toute personne ayant à analyser un système de mesure : métrologues, ingénieurs test, qualitatifs ...

Méthode pédagogique : Pédagogie active mêlant exposés, exercices et applications pratiques.

Chaque participant pourra mettre en œuvre les applications dans le logiciel de son choix parmi Minitab, JMP, StatGraphics ou R.

Modalités d'évaluation : Un formulaire d'auto-évaluation proposé en amont de la formation nous permettra d'évaluer votre niveau et de recueillir vos attentes. Ce même formulaire soumis en aval de la formation fournira une appréciation de votre progression.

Des exercices pratiques seront proposés à la fin de chaque séquence pédagogique pour l'évaluation des acquis.

En fin de formation, vous serez amené(e) à renseigner un questionnaire d'évaluation à chaud.

Une attestation de formation vous sera adressée à l'issue de la session.

Trois mois après votre formation, vous recevrez par email un formulaire d'évaluation à froid sur l'utilisation des acquis de la formation.

Accessibilité : Vous souhaitez suivre notre formation Formation par logiciel et êtes en situation de handicap ? Merci de nous contacter afin que nous puissions envisager les adaptations nécessaires et vous garantir de bonnes conditions d'apprentissage

Tarifs :

- Présentiel : 1100 € HT

- Distanciel : 1000 € HT

(-10% pour 2 inscrits, -20% dès 3 inscrits)

Option(s) :

- Forfait déjeuners : 40 € HT

Nos prochaines sessions**Distance**

du 12 au 13 décembre 2024

du 27 au 28 mai 2025

du 6 au 7 novembre 2025

Lyon

du 3 au 4 avril 2025

du 4 au 5 septembre 2025

Paris

du 16 au 17 juin 2025

du 29 au 30 octobre 2025

Toulouse

du 12 au 13 décembre 2024

du 20 au 21 mai 2025

du 20 au 21 novembre 2025

Programme :**- Introduction**

- La maîtrise des systèmes de mesure : de quoi s'agit-il ? Qu'apporte-t-elle ? Comment s'intègre-t-elle dans la maîtrise statistique des processus ?

- Le vocabulaire de la métrologie**- Introduction au logiciel statistique****- Inférence statistique et systèmes de mesure**

- Intervalle de confiance
- Tests de comparaison
- Technique des tests appariés

- Les différentes techniques de l'analyse des systèmes de mesure

- Vocabulaire de la métrologie basé sur le VIM
- Résolution, biais et linéarité
- Différence entre étalonnage et incertitude de mesure
- Échantillonnage
- Comparaison d'éléments du système de mesure
- Etalonnage et maîtrise statistique de l'étalonnage

- Etude d'incertitude (Gage R&R) : les bases

- Le principe
- Le calcul des variances de la mesure et des objets mesurés
- Écart type total : méthodes de calcul
- Les guardbands: calcul et mise en œuvre
- Les indices R&R, Cpm et P/T
- Les critères d'acceptation
- Sources de variation, facteurs croisés et facteurs nichés

- Etude d'incertitude : approfondissements

- Plans d'expériences optimaux pour une étude d'incertitude
- Le nombre de pièces nécessaire à une étude d'incertitude
- Les cas des mesures destructrices

- Cas de mesures nominales

- Le principe
- Les indices Kappa
- Mise en œuvre

Date de dernière modification : 18 novembre 2024